V. 86, N 3

## СПЕКТРЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭВТЕКТИКИ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Er<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>

## В. М. Марченко

УДК 535.34:541.12.017

Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской АН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38, Россия; e-mail: vmarch@kapella.gpi.ru

(Поступила 22 ноября 2018)

Спектры термического излучения эвтектики  $Al_2O_3/Er_3Al_5O_{12}$  (EAG), используемой в термофотовольтаике, интерпретированы методом разложения на спектры излучения оксидов  $Al_2O_3$  и  $Er_2O_3$ . Доля селективного излучения ионов  $Er^{3+}$  при температуре EAG 1500 K ~0.2 и максимальна в  $Er_2O_3$ покрытии.

Ключевые слова: спектр термического излучения, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Er<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, эвтектика.

The thermal emission spectra of the  $Al_2O_3/Er_3Al_5O_{12}$  (EAG) eutectics used in thermophotovoltaics are interpreted by decomposing on the emission spectra of  $Al_2O_3$  and  $Er_2O_3$  oxides. The part of selective emission of  $Er^{3+}$  ions at EAG temperature of 1500 K is about 0.2 and is maximal in the  $Er_2O_3$  coating. **Keywords:** spectra of thermal emission,  $Al_2O_3/Er_3Al_5O_{12}$ , eutectics.

В последнее время интенсивно ведутся комплексные исследования синтеза материалов для эмиттеров селективного излучения (СИ) в термофотовольтаических электрогенераторах (ТФВЭГ). По совокупности физико-химических свойств перспективным материалом для эмиттеров СИ в ТФВЭГ считается эвтектика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Er<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (EAG) [1—4]. Спектр СИ ионов Er<sup>3+</sup>в эрбиевых керамиках в области  $\lambda \approx 1.5$  мкм при  $T \sim 1000$ —2000 К соответствует спектральной чувствительности фотовольтаических диодов GaSb и InGaAs. Энергетика ТФВЭГ зависит от эффективности конверсии тепловой энергии в СИ экранированных электронных состояний ионов Er<sup>3+</sup>. Интенсивность термического излучения увеличивается с температурой, однако интенсивность СИ насыщается при T > 1500 К [4]. Этот эффект объясняется термически активированной безызлучательной релаксацией, вероятность

которой увеличивается вследствие переноса энергии между ионами к "киллерам". В данной работе проведен анализ спектров термического излучения EAG в области 0.75—8.00 мкм [1, 2] методом разложения суммарного контура на спектры оксидов Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

На рис. 1 (кривая *1*) показан спектр термического излучения ЕАG в области 0.75—8.00 мкм при измеренной термопарой температуре  $T_c = 1500$  К [1]. Спектр является суперпозицией полос излучения ионов  $\text{Er}^{3+}$  на переходах экранированной 4*f*-электронной оболочки и сплошного пьедестала. Термодинамически равновесный сплошной спектр черного излучения [5, 6] описывается функцией Планка  $P(v,T) = a_1 v^3/(\exp(a_2 v/T) - 1)$ , где  $a_1$  — варьируемая константа,  $a_2 = hc/k$ , h и k — постоянные Планка и Больцмана, c — скорость света, v — волновое число. Максимум P(v,T) при T = 1500 К после пересчета в спектр длин волн находится на  $\lambda \approx 3$  мкм (кривая 2). Однако максимум вписанной в экспериментальный спектр функции P(v,T) расположен при  $\lambda \approx 1.88$  мкм (кривая 3) и соответствует  $T \approx 2700$  К. Спектр 4 — разность экспериментального *1* и расчетного 3 спектров при одинаковой температуре  $T \approx 2700$  К при термическом равновесии электронной оболочки ионов  $\text{Er}^{3+}$  и сплошного пьедестала.

Сравним спектры термического излучения на рис. 1 со спектрами  $Er_2O_3$  и  $Al_2O_3$ . Температурная зависимость спектров термического излучения  $Er_2O_3$  исследовалась в [7—9]. Полосы излучения в области 0.75—1.80 мкм на рис. 1 соответствуют электронным переходам ионов  $Er^{3+}$ . На рис. 2

## SPECTRA OF THERMAL EMISSION OF Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Er<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> EUTECTICS

**V. M. Marchenko** (*A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, 38 Vavilov Str., Moscow, 119991, Russia; e-mail: vmarch@kapella.gpi.ru*)

показаны спектр Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> из работы [1] при  $T_c = 1500$  К и его интерполяция суперпозицией функций Планка и Гаусса:  $I = P(v,T) + a_3 \exp(-2((v - v_m)/w)^2)$ , где  $a_3$  — варьируемый множитель,  $v_m = 1881$  см<sup>-1</sup> и w — частота максимума и полуширина на полувысоте длинноволновой полосы с последующей конверсией в длинноволновые спектры. Сопоставление рис. 1 (кривая 3) и рис. 2 (кривая 2) показывает совпадение максимумов планковских функций. Следовательно, сплошной пьедестал термического излучения EAG в области 4.1—6.6 мкм определяется центрами излучения сапфира [10].



Рис. 1. Спектры термического излучения эвтектики  $Al_2O_3/Er_3Al_5O_{12}$  при  $T_c = 1500$  К (1), функции Планка  $P(\lambda, T = 1500$  К) (2) и  $P(\lambda, T \approx 2700$  К) (3); 4 — разность спектров 1 и 3



Рис. 2. Спектры термического излучения  $Al_2O_3$  при  $T_c = 1500$  K (1) [1],  $P(\lambda, T \approx 2700$  K) (2) и интерполяция функцией Гаусса (3)

На рис. 3 приведены экспериментальные спектры термического излучения сапфира в области 3.4-25 мкм при T = 1930 К [11] и поглощения при нормальных условиях [12]. Полосы поглощения сапфира в этой области определяются переходами ионных осцилляторов кристаллической решетки в возбужденные состояния. Сдвинутые в коротковолновую область полосы термического излучения сапфира появляются в результате переходов ионных осцилляторов из возбужденных состояний в основные.

В запрещенной зоне сапфира отсутствуют возбужденные электронные состояния [13],  $hvc < E_g = 6.7$  эВ, поэтому спектры поглощения сапфира в области 1—4 мкм не зарегистрированы и термическое излучение не объясняется внутризонными переходами. Зависимость электропроводности о монокристаллов сапфира при T = 1273—1723 К от температуры и давления кислорода в окружающей атмосфере исследовалась в работах [14, 15]. Внутренняя электронная электропроводность сапфира  $\sigma \approx \sigma_0 \exp(-E_a/kT)$ , где  $\sigma_0 = 3 \cdot 10^3 \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ , энергия активации  $E_a = E_g/2$ . В связи с этим в [10] высказано предположение, что планковская форма коротковолновой полосы термического излучения сапфира в воздухе определяется взаимодействием электронов и ионов в зоне проводимости кристаллической решетки.



Рис. 3. Спектры излучения (1) при T = 1930 К [11] и поглощения (2) [12] Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Таким образом, анализ спектров подтверждает, что эвтектика EAG является двухфазным композитом микрокристаллов  $Er_2O_3$  и  $Al_2O_3$ . Доля интегральной интенсивности термического излучения сапфира  $I(Al_2O_3)/I(EAG) \approx 0.8$ . Можно ожидать уменьшения соответствующей доли в эрбиевых керамиках с большей концентрацией  $Er^{3+}$  и минимума в слоях  $Er_2O_3$ . Насыщение интенсивности селективного излучения при T > 1500 К в [4] связано с увеличением интенсивности планковского излучения сапфира, т. е. с уменьшением коэффициента конверсии тепловой энергии в селективное излучение. Полученные результаты могут использоваться в термометрии для анализа энергобаланса и кинетики термического излучения широкозонных оксидов в термофотовольтаических электрогенераторах [16] и для радиационного охлаждения гиперзвуковых моделей [17].

[1] H. Sai, H. Yugami, K. Nakamura, N. Nakagawa, H. Ohtsubo, Sh. Maruyama. Jpn. J. Appl. Phys., 39 (2000) 1957—1967

[2] N. Nakagawa, H. Ohtsubo, Y. Waku, H. Yugami. J. Eur. Ceram. Soc., 25 (2005) 1285-1291

[3] M. C. Mesa, P. B. Oliete, R. I. Merino, V. M. Orera. J. Eur. Ceram. Soc., 33 (2013) 2587-2596

- [4] P. B. Oliete, A. Orera, M. L. Sanjuán, R. I. Merino. Sol. Energy Mater. Solar Cell, 174 (2018) 460-468
- [5] Макс Планк. Введение в теоретическую физику. Теория теплоты, Москва, КомКнига (2006)

[6] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. Статистическая физика. Ч. І. 3-е изд., Москва, Наука (1976)

- [7] G. E. Guazzoni. Appl. Spectrosc., 26 (1972) 60-65
- [8] В. М. Марченко, Л. Д. Исхакова, М. И. Студеникин. Квант. электрон., 43, № 9 (2013) 859—864
- [9] Wang Hu Jun, Ye Hong, Zhang Yu Zhi. Sci. China, Technolog. Sci., 57 (2014) 332-338
- [10] V. M. Marchenko. Phys. Wave Phenom., 26 (2018) 285-288
- [11] R. M. Sova, M. J. Linevsky, M. E. Thomas, F. F. Mark. Johns Hopkills APL Technical Digest, 13 (1992) 368—378
- [12] M. Saniger. Mater. Lett., 22 (1995) 109-113
- [13] А. Н. Магунов. Спектральная пирометрия, Москва, Физматлит (2012)
- [14] E. R. Dobrovinskaya, L. A. Lytvynov, V. Pishchik. Sapphire, Springer Science+Business Media, LLC (2009)
- [15] K. Kitazawa, R. L. Coble. J. Am. Ceram. Soc., 57 (1992) 245-250
- [16] H. Daneshvar, R. Prinja, N. P. Kherani. Appl. Energy, 159 (2015) 560-575
- [17] В. И. Алферов, В. М. Марченко. Теплофиз. выс. температур, 50 (2012) 550—554